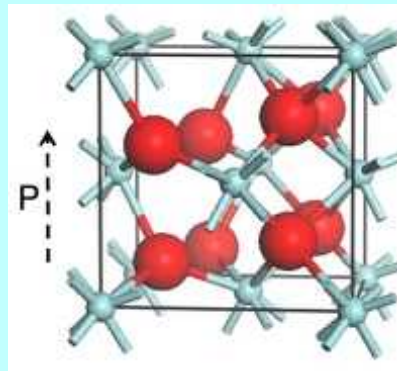


# HfO<sub>2</sub>系結晶薄膜の強誘電性発現から破壊までの調査研究

From the emergence to breakdown in HfO<sub>2</sub> ferroelectric thin films

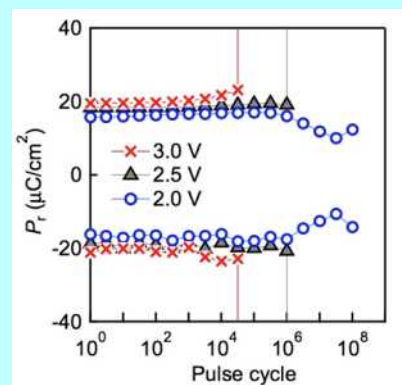
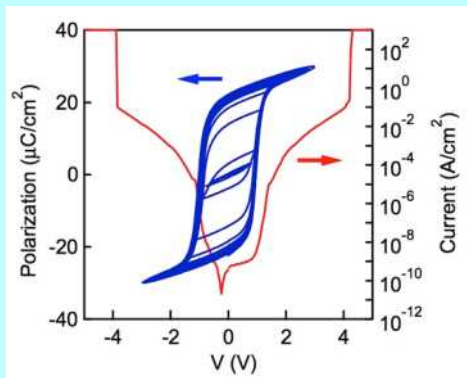
HfO<sub>2</sub>系の強誘電性がどのようにして現れ、メモリ特性の寿命はどのように決まるのか、基礎物性から応用課題までを調査研究する。

## HfO<sub>2</sub>系強誘電体



課題：  
起源が未解明

メモリ寿命が  
不明



研究：  
光学特性評価

寿命のモデリング

産総研とNIMSが中心となって試料作成と電気特性評価を行い、複数の大学と共同で研究を進める。